

表示・起源分析技術研究懇談会

第 21 回講演会のご案内

【講演会概要】

日 時: 2019 年 8 月 8 日 (木) 13:30～

場 所: 東京電機大学 東京千住キャンパス 1 号館 2 階 1205 教室

東京都足立区千住旭町 5

アクセス: JR 常磐線, 東京メトロ日比谷線, 千代田線,

北千住駅東口(電大口)徒歩 1 分 徒歩 1 分

アクセス情報およびキャンパスマップはこちら

【プログラム】(敬称略)

13:00 受付開始

13:30～13:40 開会のあいさつ

安井 明美 委員長

13:40～14:30 大麻のキャラクタリゼーションの検討

岩田 祐子 (科学警察研究所)

14:30～14:45 休憩 (15 分)

14:45～15:35 イオン付着イオン化質量分析法:

分子量マーカーによる化成品の化学組成・製品由来の簡易識別法

三島 有二 (神戸工業試験場)

15:35～15:50 休憩 (15 分)

15:50～16:40 考古学資料・農作物の起源・産地推定に向けた広域 Sr 同位体比図の作成

太田 充恒 (産業技術総合研究所)

16:40～16:45 閉会のあいさつ

講演会後, 懇親会を開催予定です。

参加費

講演会参加費 (含要旨代): 会員 無料, 非会員 1,000 円, 学生 無料